

**Judul:**

Determination of thin films thickness by tolansky interferometry

**Pengarang/Penulis:**

Farid Wadjdi Machmud, author

**Subjek:**

Interferometry

**Nomor Panggil:**

T-Pdf

**Penerbitan:**

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)